

## 分析走査電子顕微鏡



### 分析走査電子顕微鏡

日本電子(株)

JSM-IT300LA

平成28年度導入

(公財) JKA 補助事業



### 【主な用途・仕様】

製品・部品・材料の観察、元素分析を行う装置です。

- ・ 加速電圧・倍率：0.3～30kV・5～30万倍
- ・ 低真空圧力設定範囲：10～650Pa
- ・ 試料移動範囲：X軸 125mm、Y軸 100mm、WD 5～80mm  
傾斜 -10～90°、回転 360° エンドレス
- ・ 最大試料サイズ：φ200mm、高さ 80mm
- ・ 分析可能元素：ベリリウム (4Be) からウラン (92U)
- ・ 分解機能：定性分析 (自動、手動)、簡易定量分析、デジタルマッピング
- ・ 観察補助機能：ステージナビゲーション、チャンバースコープ
- ・ データ形式：画像 (BMP, TIFF, JPEG)、動画 (AVI)  
観察・分析レポート (ワード形式)

### 【設備使用】

分析走査電子顕微鏡

### 【委託分析試験】

電子顕微鏡写真

EDS 定性分析 (固体、粉末)